

PROGRAM SYMPOZJUM

METROLOGIA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA -6

Szczyrk, 01-03.12.2010r.

PARTNERZY - WSPÓŁORGANIZATORZY

Wojskowe Centrum Metrologii MON

PKN Polski Komitet Normalizacyjny

GUM Główny Urząd Miar

PCA Polskie Centrum Akredytacji

PIAP Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów

IZTW Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy

Maszyn, Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii

Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Instytut

Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

ORGANIZATOR TECHNICZNY



BZJ Biuro Zarządzania Jakością,
Środowiskiem i BHP

www.bzj.pl

01.12.2010r. - środa

13.00 - 14.00 Obiad

14.00 - 18.30 Sesja I

- **Znaczenie metrologii w systemach zarządzania** - dr inż. *Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechnika Warszawska*
- **Wybrane aspekty sterowania jakością pomiarów i badań** - dr inż. *Piotr Pajzderski, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej*
- **Dobór wyposażenia pomiarowego do wymagań procesu technologicznego i sposoby ich monitorowania** - inż. *Wiesław Zaborowski, Faurecia Fotele Samochodowe*

16.00 – 16.30 Przerwa kawowa

- **Aspekty metrologiczne objęte pracami organizacji normalizacyjnych** – inż. *Alicja Gach, PKN*
- **Wiarygodność orzekania o zgodności z wymaganiami** – dr inż. *Jerzy Arendarski, Politechnika Warszawska Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej*
- **Aspekty metrologiczne w zagrożeniach bezpieczeństwa** - prof. dr inż. *Tadeusz Missala PIAP*

19.30 kolacja

02.12.2010r. – czwartek

8.00 - 9.00 Śniadanie

9.00 - 13.00 Sesja II

- **Kierunki rozwoju metrologii w kraju i na świecie** - mgr inż. *Elżbieta Michniewicz, GUM*
- **Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym** - mgr inż. *Robert Rzepakowski, GUM*
- **Wzorcowanie przyrządów pomiarowych w akredytowanych laboratoriach wzorcujących, podstawą zapewnienia wiarygodności pomiarów** - mgr inż. *Ryszard Malesa, PCA*

11.00 - 11.30 Przerwa kawowa

- **Zgodność ze specyfikacją, ocena i interpretacja świadectw wzorcowania** - mgr inż. *Anna Warzec, Instytut Łączności PIB*
- **Przedziały ufności dla krzywych kalibracyjnych a niepewność pomiarów** - prof. dr hab. inż. *Sabina Żebrowska-Łucyk, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechnika Warszawska*

13.00 - 15.00 Przerwa obiadowa

15.00 - 18.00 sesja III

- **Działalność kluczowych organizacji międzynarodowych, europejskich i krajowych w zakresie metrologii**
Jolanta Kocharńska Wiceprezes PKN
- **Wybrane lotnicze systemy nawigacyjne w aspekcie zabezpieczenia metrologicznego samolotu wielozadaniowego F-16** - *Karol Kasprzak, Specjalistyczny Wojskowy Ośrodek Metrologii*

16.30 - 17.00 Przerwa kawowa

- **System wsparcia informatycznego metrologii wojskowej SIMW LOGIS_NET** - *Krzysztof Bednarkiewicz, Wojskowe Centrum Metrologii*
- **Normalizacyjne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego** - *dr Grażyna Ożarek, PKN*

18.30 Kolacja grillowa

03.12.2010r. – piątek

8.00 - 9.00 Śniadanie

9.00 - 12.00 sesja IV

- **Zautomatyzowane stanowiska odbiorcze dopuszczaniu wyrobów do eksploatacji, jako element Systemu Zarządzania Jakością** - *mgr inż. Marcin Safinowski PIAP*
- **Rozwój i zakres zastosowania technik pomiarów topografii powierzchni na przykładzie przyrządów IZTW** - *mgr inż. Tatiana Miller, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania*
- **Stanowisko pomiarowe do kalibracji mierników poziomu dźwięku, kalibratorów dźwięku oraz wojskowych urządzeń akustycznych do wykrywania strzału i lokalizacji strzelca** - *Wiesław Wronko, Wojskowe Centrum Metrologii*
- **Wzorzec jednostki mocy średniej i energii promieniowania laserowego** - *Marcin Bociek, Wojskowy Ośrodek Metrologii, Zespół Badań i Opracowań Metrologicznych*

12.00 Obiad